THE OBSERVATION OF THE COUPLER OF THE KEKB ARES CAVITY WITH THE PMT ARC SENSOR

Yoshiharu Yano [#], Kiyokazu Ebihara, Kazuo Yoshino, Hiroshi Sakai, Tatsuya Kageyama, Shinichiro Michizono,

Shigeki Fukuda

High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801 Japan

Abstract

We developed the arc sensor using PMT and the optical fiber. We were able to catch the small emission of light that we were not able to look at so far. When KEKB is running, a Cherenkov light was observed at considerable strength. These light spoil the reliability of the arc sensor. We examined measures.

PMT アークセンサによる KEKB ARES 空洞のカプラーの観測

1. はじめに

クライストロンの RF 窓、空洞の RF 入出力カプ ラーなどの放電をいち早く検知し RF を停止する為 にアークセンサが用いられるが、光をビューポート 直後で電気信号に変換した場合、様々な電気ノイズ による誤動作で不必要にインターロックをかける事 が多かった。しかし、ビューポートでとらえた光を 光ファイバーで制御室まで導きそこで電気信号に変 換すればノイズによる誤動作を減少することが出来 る。これまで光ファイバーを使う事によるディメ リットを補う為に光電子増倍管(PMT)を使った高感 度アークセンサを開発してきた。^{1),2)} ここでは KEKB ARES 空洞入力カプラーのセラミックス窓か らの発光を観測した結果を報告する。観測は ARES 空洞テストスタンドと KEKB 加速ステーション D8-Dの2カ所で行った。テストスタンドでは通常の放 電光の他に TV カメラでは見えない微弱光を観測し た。D8-D では、KEKB 運転時、ビームロスにより 光ファイバー中で強いチェレンコフ光が発生するこ とが観測され、この光信号処理を現在検討中である。

2. 光ファイバーとアークセンサ

光ファイバーは純粋石英、ステップインデックス 構造、コア径 600μm で紫外~可視光(300~800nm) で透過率の高い物を使用した。両端には FC コネク タが付けられビューポートアダプタとアークセンサ モジュール間を簡単に接続する事が出来る。テスト 信号用の LED を付けたアダプタを示す。(写真 1)



写真1:ビューポートアダプタとキャップ

[#] yoshiharu.yano@kek.jp

最新のアークセンサモジュール(Ver.5)は 4-ch の PMT を NIM 2 巾のモジュール内におさめそれぞれ 独立に信号をモニターしながらゲインとインター ロックレベルの設定をすることが出来る。PMT と アークセンサモジュールを示す。(写真 2)



写真2: PMT とアークセンサモジュール

PMT(H6780)の感度波長範囲は 300nm~650nm であ りシステム全体としては 300nm~650nm の光に対し て感度を期待出来る。ただ、高感度領域を利用して 微弱な光を観測しようとすると PMT 個々の特性の 違いが顕著になるため注意が必要である。ここでは 表1に示すモジュールのチャンネル1のみを使用し た。

表1:アークセンサモジュール

バージョン	Ver. 4	Ver. 5
TYPE	T2743-01	T3018-01
SER. NO.	10803-027-02	11004-007-01

3. ARES テストスタンドでの試験

3.1 ARES TEST 空洞

ここでは KEKB の ARES TEST 空洞で行ったコン ディショニング時の発光現象と新品カプラーのエー ジング時の発光現象について述べる。TEST 空洞は MR-D1 電源棟に設置され新品カプラーのエージング やその他様々な試験を行っている。TEST 空洞出力 カプラー側からの写真と入力カプラーに設置した アークセンサを示す。(写真 3)



写真3: TEST 空洞とアークセンサ

写真ではアダプタが見えているが試験では隙間からの光でノイズフロアーが上がるのでアルミホイル で遮光している。

3.2 エージング済みのカプラー(Ver.4 で観測)

このカプラー(MBC042)は 800kW までエージング が済んだ物でセラミックの純度が高く 250kW 程度 の RF パワーでセラミック自体の発光が始まる事が 監視カメラで確認されている。

RF パワーが 150kW に達した頃から発光と思われ る微弱信号が確認され始め、徐々にパルス高及び頻 度が上昇し、250kW 付近で信号のベースが上がり始 めた。この発光には 5msec の周期がある事が観測さ れた。(写真 4)



(左; 240kW,右; 510kW) 写真4:パルス波形(200mV/div,1 µ sec/div) & 5msec 発光周期(200mV/div,10msec/div)



(左上;500kW,右上;520kW,左下;530kW,右下;530kW)
 写真5:様々な発光パターン(100mV/div,1sec/div)
 左上の画像のみ(20mV/div,1sec/div)

300kW~530kW は監視カメラでも見られていた間 欠発光の様子が観察された。RF OFF 直後にも空洞 に残ったパワーによると思われる弱い発光が観測さ れた。写真5に様々な発光パターンを示す。

3.3 新品カプラーのエージング(Ver.5 で観測)

このカプラー(MBC044)はマルチパクタリングの 発生を抑えるため同軸ライン外胴体の内側に溝を加 工した構造になっている。⁴⁾ カプラー直前の方向 性結合器でカプラーからの反射波をモニターに加え た。エージングプログラムはカプラーの真空が設定 値以下の条件で RF パワーを上げて行くよう設定さ れている。

1) 初期(RF~150kW):

2~4 分の間隔で約1秒間発光する状態がほぼ2 時間続いた。発光と真空のハネは同期していた。



後半は発光間隔が 短く発光時間が長 くなりほぼ連続し て発光する状態に なり真空のハネは 見られなくなった。 (写真 7)

(150kW 時)

写真7:連続発光時(10mv/div, 1sec/div)

2) 中期(RF 150~300kW):

エージングが進んで行くにつれ 4~5 分の間隔 で 5~10 秒間バースト的に発光するようになった。 そのうち発光間隔が短くなり波のある発光がし ばらく続き、そのうち 1 秒間に 10 回程度 10msec の短い発光が見られるようになった。RF 160kW 付近では反射波形は特に変化しなかったが、RF 180kW に達した頃から反射波にのこぎり状のパ ターンが見られる様になった。(写真 8)



(左; 164kW, 右; 185kW) 写真 8 : 反射波形 (20mv/div, 2msec/div)

しばらくすると連続発光が治まり 5~10 分おき に強い発光が起きる様になった。強い発光の終 わりには反射波形が減少する時と増加する時が 観測された。(写真 9)



(左; 180kW, 中; 267kW, 右; 277kW) 写真 9 : ch-1(左, 中;20mv/div, 右; 10mv/div) ch-3(50mv/div), 1.0sec/div

ここで ch-1 は PMT のモニター信号、ch-2 はイン ターロック信号、ch-3 はカプラーの反射信号である。

3)後期(RF 300~800kW):

300kW 付近では強い発光が治まり弱い発光の 頻度が上昇した。発光の状態に多少の変動はあ るが特に強い発光も無く 800kW まで RF パワー は上昇した。後日再度 RF を投入したとき 750kW 付近で非常に強力な発光と反射波の減少及び真 空のハネが観測された。(写真 10) ここでイン ターロックのしきい値は 1V に設定されている。 この映像はカプラーのどこかでアーク放電が始 まって約 13 秒後に光ファイバーの視野角内に放 電が拡大し約 15 秒後に治まった現象を捉えたも のと思われる。



写真 10 : カプラーの反射(100mv/div, 1sec/div)と アークセンサの信号(500mv/div, 1sec/div)

4. KEKB ARES 空洞での試験

4.1 KEKB ARES 空洞

KEKB で運転中の ARES 空洞の入力カプラーに設置した本機で観測した光について述べる。1 箇所しか無いビューポートに既設のアークセンサ(フォトダイオードと発光ダイオードのセット)が設置してあり取り外す事が出来ないため、アダプターに既存のアークセンサの基板を組込んだ。D8-D の ARES 空洞とフォトダイオードと発光ダイオードを組込ん だアークセンサヘッドを示す。(写真 11)



写真 11 : センサヘッド部と D8-D ARES 空洞

4.2 ビーム運転中のアークセンサの誤動作

既存のアークセンサはビーム入射時とアボート時 に誤動作を起こすためこの期間はインターロックを 動作させない様にしていた。それはビューポート直 後で電気信号に変換し、地下→電源室→制御室まで 約 100m の距離を引き回しておりその過程でノイズ が乗り誤動作していると思われてきた。

PMT アークセンサで観察したところ運転中でも弱い発光と宇宙線による低頻度の発光のみが見られた。

しかし、HER 入射に同期して強力な発光が確認さ れた。(写真 12)



写真 12: HER 入射時の信号(200mv/div, 1sec/div)

比較の為に RF 投入前と投入後の信号レベルの様 子を示す。(写真 13)



写真 13 : RF 投入前後(50mv/div, 1sec/div)

写真 13 で時々高い信号が見えるがこれは宇宙線 が PMT の光電面に入射した時の信号である。写真 12 のような信号が見えるのは HER 入射時とビーム アボート時だけで LER 入射時には観察されない。 しかもアボート時に観測される信号レベルは 1.5~2.0v もあり感度を上げた場合インターロックの 設定レベルを超えてしまう。PMT の感度を下げて使 うと今まで見てきた発光の細かな様子を観測する事 は不可能になる。この光の原因は HER 入射時の ビームロスで出来た荷電粒子が光ファイバーケーブ ルを通過する時に出るシンチレーション光かチェレ ンコフ光であると考えられる。既存のアークセンサ もこの荷電粒子がフォトダイオードを通過して出る 信号により誤動をしていたものと考えられる。PMT の信号を直接観測したところ、4nsec 程度で立ち上 がっているためこの光はチェレンコフ光であると判 断した。

4.3 チェレンコフ光のスペクトル

チェレンコフ光は物質中を進む荷電粒子がその物 質中の光速を超えた場合に発生する。

n;物質の屈折率 θc;チェレンコフ光の放出角度 とすると次の関係がある。 $\beta > 1/n, \cos \theta c = 1/(n \beta)$

```
単位長さあたり放出される光子数は(Frank-Tamm)

α;微細構造定数(=1/137)

λ;チェレンコフ光の波長

とすると次の関係がある。
```

 $Np = 2 \pi \alpha \oint (\sin^2 \theta c / \lambda^2) d\lambda$

短波長の光が強く出ていることが分かる。ファイ バーの透過特性と PMT の感度特性を考慮すると 400nm より短い波長の光を落とす必要がある事が推 測される。

4.4 チェレンコフ光とフィルター

問題の光のスペクトルを計測する事を試みたが ビームによるチェレンコフ光は連続光ではないため 通常の分光器では光量不足で測る事は出来なかった。 そこで、光ファイバーの接続部分に赤フィルムを挟 み込み信号の比較をおこなった。写真 14 にフィル ムがある場合と無い場合の信号レベルを比較した。 (左; フィルム無し,右; 赤フィルム)



写真14:フィルムによる減衰比較

(50mv/div, 1sec/div)

赤フィルムを挿入したものは明らかに問題の信号 レベルが下がっている。

4.5 KEKB 運転時のカウンティングレイト

半割の FC コネクタの間に青、緑、黄色、赤の 4 色のフィルムを挟んだ簡易フィルターを作り減衰の 様子を比較した。測定ではモジュールのインター ロックレベルとゲインを調整し、インターロックパ ルス数を計測し発光頻度の比較を行った。

RF 投入時の様子を測定する為にフィルター無し でアークセンサの感度を最大(10.00)、インターロッ クレベルを最小(0.00)に設定し毎秒のカウンティン グレイトを測定した。D8-Dの RF 投入時から待機状 態までの様子を示す。(図 1)



図1: RF 投入時の発光数/秒

HER (0.0A), LER (1.6A), D8D (596kW), 感度(10.00), レベル(0.10)の条件でフィルターを変更した場合の 1 秒間のカウント数である。(図 2)



図2:フィルターによるカウント数の違い

マルチパクタによる光は黄フィルムを通した場合がやや多くなっているが大きな差は見られない。

HER, LER 同時入射, 感度(10.00), レベル(0.20)の 条件でフィルターを変更した場合の 1 秒間のカウン ト数である。(図 3)



(N;無し、B;青、G;緑、Y;黄、R;赤フィルター) 図 3 : HER, LER 同時入射

1 種類のフィルターで計測中にカウント数がくし 状に増減している。HER 入射時にチェレンコフ光を 感じてカウント数が増えている。その他の時はマル チパクタの光であるため数カウントしかない。この 図から赤のフィルターでかなりのチェレンコフ光が 落ちているのが分かる。

ハロゲンランプを使って簡易フィルターの透過特 性を計測した結果を示す。(図 4)



以上からチェレンコフ光は~550nm より短波長の 成分がほとんどであると推測出来る。

赤フィルターを通したアークの信号は未確認なの で断定はまだ出来ないが、赤フィルターを使えば ビームロスの多い所でも光ファイバーを使ったアー クセンサの使用が可能であろう。ビームロスの比較 的少ない D5-C での測定も行ったがこちらはチェレ ンコフ光をほとんど感じなかったので問題なく使え るであろう。

5. 最後に

KEKB の運転は 2010 年 6 月で終了するため測定 機器を揃える時間的余裕が無く校正された測定器を 使っての測定は出来なかった。そのためこれらは参 考データにしかならないが、KEKB の運転が再開さ れるまでの間、テスト空洞と Linac で追測定を行い SuperKEKB で PMT アークセンサを採用出来るよう 試験を続けたい。また放射線下での光ファイバーの 耐久性については未調査であるので今後この件につ いても調査を進めて行く。

ところでアークセンサにとってチェレンコフ光は 邪魔者であるが、ビームロスモニターのセンサーと して見た場合、光ファイバーは有効なセンサーとし て使える。立ち上がりの早い PMT を使いファイ バーの解放端にミラーを付け、ファイバー上で発生 した光の直接光と反射光の時間差を測定すればファ イバー上で荷電粒子が通過した場所を特定すること が出来る。これをビームダクトに平行に複数本張れ ばビームロスの発生箇所を特定するデータになる可 能性がある。今後は、これについても検討を進めて 行きたい。

参考文献

- [1]矢野喜治ほか"光電子増倍管を利用したアークディテ クターの開発"第34回リニアック技術研究会、和光、 2007
- [2] 矢野喜治ほか"cERL 用アークディテクターの開発" 第 36 回リニアック技術研究会、東海村、2009
- [3] T. Kageyama et al. "The ARES Cavity for KEKB", Proc. of e+e- Factories '99, Tsukuba, Sep.1999.
- [4] Tetsuo Abe et al. "Multipactoring suppression by fine grooving of conductor surfaces of coaxial-line input couplers for high beam current storage rings" KEK Preprint 2009-42 February 2010 A